

INSCRIPCIÓN

Los derechos de inscripción ascienden a:

350 Euros (IVA Incluido)

Se incluye además de las charlas teóricas y sesiones prácticas, documentación científica y técnica actualizada sobre el objeto del curso.

Se incluye la comida del medio día.

Modo de pago: transferencia a la Cuenta :

BSCH 0049 1803 52 2410025022

Bruker Española, S.A. CIF A-28315539

** Indicar en la transferencia Curso "Métodos de refinamiento y ajuste de difractogramas"*

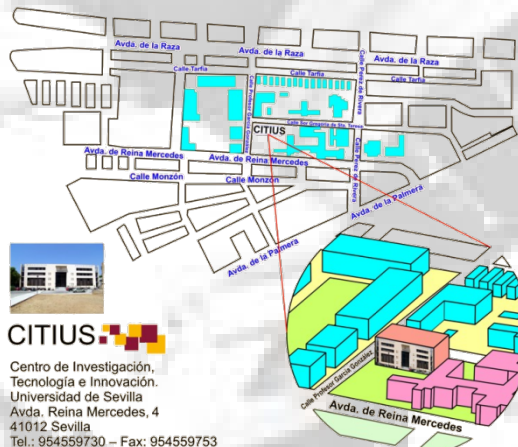
REQUERIMIENTOS:

Para la realización de los ejercicios, los asistentes vendrán provistos de un ordenador portátil con sistema operativo Windows 7.



LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS). Universidad de Sevilla.



CITIUS

Centro de Investigación,
Tecnología e Innovación.
Universidad de Sevilla.
Avda. Reina Mercedes, 4
41012 Sevilla
Tel.: 954559730 – Fax: 954559753

Horario del curso:

Miércoles 19: de 16:00 a 20:00h

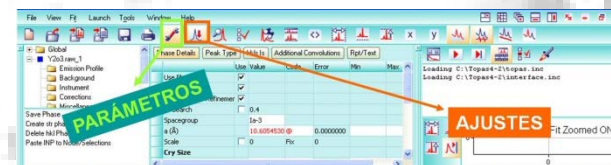
Jueves 20: de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 20h

Viernes 21: de 9:00 a 15:00



Aplicación de métodos de refinamiento y ajuste al estudio de difractogramas. Cuantificación de fases cristalinas

Sevilla, 19 al 21 de Octubre de 2011



OBJETIVOS

El principal objetivo del curso es posibilitar que el alumnado adquiera una formación especializada en métodos de refinamiento y ajuste aplicados al estudio de difractogramas, se realizará un gran hincapié en la cuantificación de fases cristalinas y amorfos.

Este curso incluye el manejo de aplicaciones informáticas, tales como el Paquete Informático TOPAS.

Se formará al alumno en el análisis de difractogramas mediante la aproximación de parámetros fundamentales (métodos de ajuste de Pawley y Le Bail), análisis microestructural, método Rietveld y análisis cuantitativo de fases cristalinas y amorfos usando TOPAS.

ORGANIZA

BRUKER, con la colaboración del Servicio General de Investigación "Laboratorio de Rayos-X" del CITIUS de la Universidad de Sevilla.

DIRECTORA DEL CURSO

Dra. Patricia Aparicio Fernández

PROFESORADO

Dra. M^a Dolores Alba Carranza. ICMSE-CSIC.

Dra. Patricia Aparicio Fernández.
Universidad de Sevilla

D. Santiago Medina Carrasco.
Universidad de Sevilla

Dra. Esperanza Pavón González.
Universidad de Sevilla

PROGRAMA DEL CURSO

1. Ajuste de perfiles. La aplicación TOPAS.
2. Parámetros de pico. Fundamentos y definiciones. Funciones analíticas.
3. Análisis basados en modelos no estructurales. Ajuste de picos puntuales. Ajuste de un grupo de picos.
4. Aproximación de parámetros fundamentales. Descomposición de diagramas. Ajuste de parámetros de red.
5. Análisis microestructural.
6. Estrategia para el registro de diagramas de difracción.
7. Refinamiento estructural mediante el Método Rietveld. I.- Intensidad de los picos: orígenes y fundamentos.
8. Refinamiento estructural mediante el Método Rietveld. II.- Análisis Rietveld con el programa Topas.
9. Análisis cuantitativo de fases mediante el método Rietveld.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Curso:

Aplicación de métodos de refinamiento y ajuste al estudio de difractogramas. Cuantificación de fases cristalinas

Sevilla, 19-21 de Octubre de 2011

Datos:

Compañía o Centro:

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Tfno.:

E-mail:

CIF:

Enviar la solicitud junto con recibo de la transferencia a bruker@bruker.es o por FAX a +34 91 6566237